

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

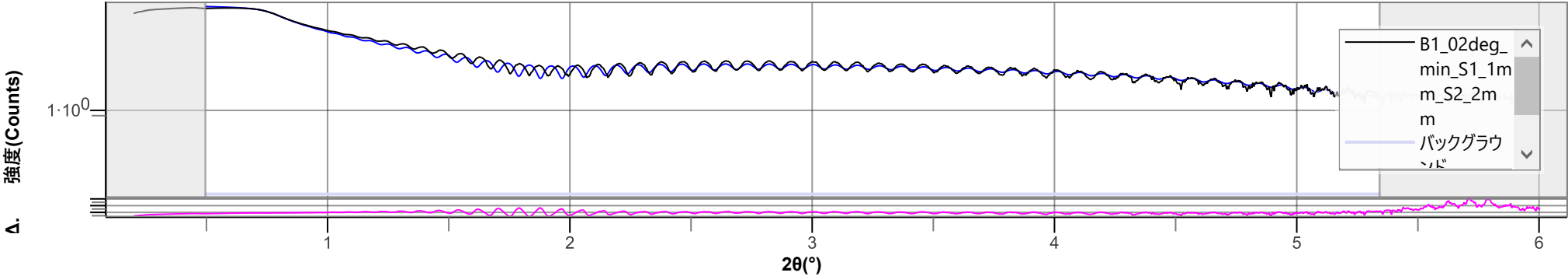
波長(nm): 0.15403
点数: 1451
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg<	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.495 ±0.017 精密化	4.94997 ±0.07 →最大 精密化	0.100 ±0.03 最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.753 ±0.013 精密化	2.47500 ±1 最小← 精密化	0.100 ±0.04 最小← 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe	92.954 ±0.9 精密化	7.87400 ±0.3 →最大 精密化	0.000 ±0.03 最小← 精密化	
	<input type="checkbox"/>	L2	Fe	87.179 ±0.04 精密化	6.62454 ±0.06 精密化	0.384 ±0.03 精密化	
	<input type="checkbox"/>	L1	Fe	0.000 ±1.3 最小← 精密化	3.93705 ±0.12 最小← 精密化	0.189 ±0.017 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	